

**Judul:**

Atom probe microscopy

**Pengarang/Penulis:**

Gault, Baptiste, author

**Subjek:**

Atomic force microscopy ; Scanning probe microscopy ; Atom-probe field ion microscopy

**Nomor Panggil:**

e20405798

**Penerbitan:**

Springer

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)